



Cinvestav

ESPECTROSCOPIA DE SUPERFICIES SÓLIDAS

Técnicas de análisis de superficies sólidas.

- Técnicas de caracterización óptica y estructural.
- Microscopía electrónica de barrido, MEB.
- Microscopía electrónica de transmisión, TEM.
- Difracción de rayos X

Técnicas espectroscópicas de caracterización.

- Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (ESCA)
- Espectroscopía de electrones Auger (AES)
- Espectroscopía de masas con iones secundarios (SIMS)

Bibliografía

- P. J. Goodhew and F.J. Humphreys, *Electron Microscopy and Analysis*, Taylor & Francis, 1992.
- B.D. Cullity, *Elements of X-ray Diffraction*, Addison Wesley, 1978.
- A.W. Czanderna, *Methods of Surface Analysis*, Elsevier, vol 1, 1975.